

**ПОДВИЖНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
В КРИСТАЛЛАХ $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$
В СОСТОЯНИИ СТИМУЛИРОВАННОЙ ПРОВОДИМОСТИ**

Л. К. Бунина, А. Ю. Кудзин, Г. Х. Соколянский

В монокристаллах $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ наблюдается явление стимулированной проводимости: после прогрева и последующего охлаждения в электрическом поле образца, снабженного инжектирующими электродами, проводимость возрастает на несколько порядков [1, 2]. Поле, при котором происходит эффективная стимуляция, выбирается на участке резкого нарастания вольт-амперной характеристики. Такое состояние кристалла сохраняется при комнатной температуре в течение длительного времени. Прогрев образца с закороченными электродами до температуры 600 К возвращает его в состояние с исходной проводимостью. Повышение прово-

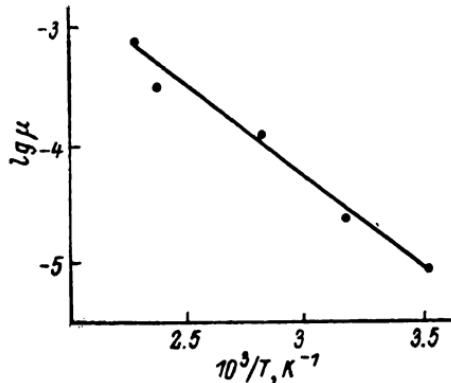


Рис. 1. Температурная зависимость подвижности носителей заряда в кристаллах $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$.

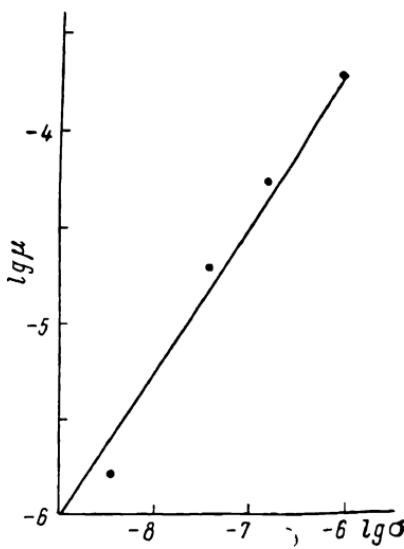


Рис. 2. Зависимость подвижности от проводимости стимулированного кристалла $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$.

димости образца не является следствием приэлектродных изменений. Показано [3], что механизм электропроводности как стимулированных, так и не стимулированных кристаллов имеет прыжковый характер.

Исследования токов, ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ), показывают, что в стимулированном состоянии подвижность носителей заряда значительно выше, чем в исходном. В работе проведено исследование дрейфовой подвижности в кристаллах $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ с применением времязадержки методики. Использовались образцы в виде плоскопараллельных пластин толщиной $d=0.2\div0.4$ мм, вырезанные из монокристалла $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$, выращенного методом Чохральского. На полированные поверхности образца наносились индий-галлиевые электроды. Образец включался в цепь последовательно с источником напряжения. С помощью ключа к образцу прикладывалась ступенька напряжения U . Переходный ток фиксировался осциллографом С8-1 с использованием закрытого входа. Параметры измерительной цепи позволяли определять времена пролета T_n от десятков микросекунд до сотен миллисекунд. Подвижность μ определялась по формуле $\mu=d^2/T_n U$. Перед измерениями образец переводился в состояние стимулированной проводимости. Прекращая нагрев при разных значениях тока, можно изменять степень стимуляции n_c (n_c — отношение проводимости в стимулированном состоянии к проводимости прогретого образца). Исследования проводились в интервале температур

293—413 К. Для того чтобы величина стимуляции сохранилась, нагрев до температуры измерения производился при том же напряжении, при котором образец стимулировался. Наблюдалось три типа переходных сигналов. В области слабых полей форма сигнала $J(t)$ имеет вид, характерный для дисперсионного переноса, т. е. во время движения фронта импульса носителей заряда в образце происходило его сильное размытие [4]. В этом случае на кривой $\lg J - \lg t$ появлялся излом. В более высоких полях на переходных характеристиках тока наблюдались либо четкий излом, либо хорошо выраженный максимум, что свидетельствует о гауссовском распределении носителей заряда по скоростям [4]. Во всех случаях время достижения излома (максимума) уменьшалось обратно пропорционально прикладываемой ступеньке напряжения, т. е. соответствовало времени T_n . Характер импульсов и величина поля, при котором происходит переход от дисперсионного к гауссовскому переносу, зависит от температуры и степени стимуляции n_c . При низких температурах и малых n_c эти поля более высокие. В области гауссовского переноса подвижность примерно на порядок выше, чем при дисперсионном. Подвижность экспоненциально возрастает с ростом температуры, изменяясь в области дисперсионного переноса от 10^{-6} см²/В·с при 293 К до $2 \cdot 10^{-4}$ см²/В·с при 413 К (рис. 1). Энергия активации изменяется при изменении степени стимуляции и характера переноса. Ранее [3] в прогретых образцах при исследовании ТОПЗ было получено значение $\mu_{\text{зф}} = 5.1 \cdot 10^{-8}$ см²/В·с при 413 К. Наблюдается корреляция между величиной проводимости σ кристалла и подвижностью ($\mu \sim \sigma^k$), где показатель $k \sim 0.7$ (рис. 2).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что увеличение проводимости кристаллов $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ при стимуляции связано с увеличением подвижности зарядов. Этот факт может быть объяснен на основании модели, предложенной в [3], согласно которой в монокристаллах $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ имеется хвост плотности состояний $N(E)$, убывающий в глубь запрещенной зоны. В процессе стимуляции вследствие заполнения уровней инженерированными из электродов носителями заряда происходит смещение уровня протекания в область энергий с большей плотностью состояний. Если перескоки носителей осуществляются по локализованным состояниям вблизи уровня протекания, то это должно привести к увеличению подвижности. При этом (согласно данным рис. 2) происходит и увеличение концентрации носителей, участвующих в перескоках ($n \sim \sigma^{(1-k)}$).

Л и т е р а т у р а

- [1] Гуенок Е. П., Кудзин А. Ю., Соколянский Г. Х. УФЖ, 1976, т. 21, № 5, с. 866—867.
- [2] Oberschmid R. Phys. St. Sol. (a), 1985, vol. 89, N 2, с. 657.
- [3] Соколянский Г. Х. Автореф. канд. дис. Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1982. 12 с.
- [4] Архипов В. И., Руденко А. И., Иову М. С., Шутов С. Д. Нестационарные инженерционные токи в неупорядоченных твердых телах. Кишинев: Штиинца, 1983. 175 с.

Днепропетровский государственный университет
Днепропетровск

Поступило в Редакцию
16 июля 1987 г.